

「知の拠点あいち」利用促進講演会

「最先端の計測分析、機器と事例」

～シンクロtron光、電子顕微鏡、X線構造解析、質量分析～



開催のご案内

主催: あいち産業科学技術総合センター

共催: (公財)科学技術交流財団

次世代ものづくり技術の創造・発信の拠点「知の拠点あいち」に整備された「あいち産業科学技術総合センター」「あいちシンクロtron光センター」の、一層の利用促進を目指し、講演会を開催させていただきます。

本講演会では、企業の方々の新製品・新技術開発や、現場で発生する課題の解決にお役立ていただくことを期待し、シンクロtron光の活用（XAFS）や、電子顕微鏡（TEM、SEM）観察・分析、表面分析（XPS）、X線構造解析（XRD）等の活用事例をご紹介します。

基調講演といたしまして、近年、発光素子、パワーエレクトロニクス、太陽電池などの分野で次々と応用が開拓され、グリーン社会実現のカギを握る材料として注目を集めている窒化物半導体、特に GaN について、「高輝度 GaN 系青色 LED の進化を支える技術開発」と題した講演を、豊田合成株式会社の奥野浩司様にお願いいたしております。今回は、名古屋大学における「オープンプラットフォーム構築支援事業」との連携企画として開催します。

また、講演後には、「当センターの分析機器」及び「あいちシンクロtron光センター」の見学会を行います。ぜひ、多くの皆様にご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。

【日 時】 平成27年3月12日(木) 午後1時30分～午後4時

【場 所】 あいち産業科学技術総合センター本部 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

【プログラム】

時間	内容
13:00 ～ 13:30	受付
13:30 ～ 13:35	開会挨拶
13:35 ～ 14:20	【基調講演】 「高輝度 GaN 系青色 LED の進化を支える技術開発」 豊田合成(株) オプト E 事業部第 1 技術部 T1 技術室チームリーダー おくの こうじ 奥野 浩司 氏
14:20 ～ 15:10	【研究成果発表】 （あいち産業科学技術総合センター共同研究支援部） 「工業材料の電子顕微鏡観察分析」 担当：計測分析室 技師 吉田 よしだ 陽子 「工業材料のナノ表面分析」 担当：計測分析室 主任研究員 なかお としあき 俊章 「有機材料の成分分析」 担当：計測分析室 技師 たなはし のぶひと 棚橋 伸仁 「シンクロトロン光利用案件組成研究 いぶし瓦」 担当：計測分析室 主任 ふくおか おさむ 福岡 修 「シンクロトロン光利用案件組成研究 めっき」 担当：計測分析室 主任 すぎやま のぶゆき 杉山 信之
15:10 ～ 16:00	【施設見学】 希望者のみ ・共同研究支援部 計測分析室 ・あいちシンクロトロン光センター

■**申込方法** 申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■**申込期限** 平成27年3月10日（火）

■**参加費** 無料

■**定員** 100名（先着順）

■**交通のご案内**

- ・東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m 側道下りてすぐ

■**申込及び問合せ先**

あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部 計測分析室

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

U R L：<http://www.aichi-inst.jp/>



「知の拠点あいち」利用促進講演会

「最先端の計測分析、機器と事例」

～シンクロtron光、電子顕微鏡、X線構造解析、質量分析～

参 加 申 込 書

平成27年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 加藤 あて

FAX : 0561-76-8317 メール : AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな		
企業名		
所在地	〒	
ふりがな		
所属・氏名		
連絡先	TEL	FAX
	メールアドレス	
見学会への参加 (どちらかに○をつけて下さい。)	参 加	不 参 加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
※受講票は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。

